## Nuclear Reaction Analysis by Using Ultra Low Intensity Electron Beam

Ryoya Sasaki, Ryoichi Taniguchi, Takao Kojima, Shuichi Okuda Radiation Research Center, Osaka Prefecture University, 1-2 Gakuen-cho, Sakai, Osaka, 599-8570

### Abstract

Energetic electron beams higher than several MeV occasionally induce direct nuclear reactions with the target nuclei. These processes are attributed to the quasi-elastic scattering of electrons (e,e') with the target nuclei and similar to the photo-nuclear reactions. These reactions are useful for the non-destructive analysis of heavy elements such as U and Th. However, the huge X-ray burst caused by the bremsstrahlung with the electron pulse bombardment was the most harmful phenomenon for the system. In this study, an ultra low intensity electron beam was used for relieving the problem, which has been developed by modifying an electron linear accelerator. The minimum beam charge about several aC/pulse has been achieved at the present. Consequently, the neutron emitted by Pb(e,e'n)Pb reaction was measured successfully by the use of the low intensity beams.

# 超微弱電子を利用した元素分析法

#### 1. 緒言

電子線形加速器から取り出される電子ビームは、 エネルギーや方向を精密に制御でき、放射性同位元 素等からのβ線とは異なり、

- ・方向が揃い、
- ・エネルギーが単色であり、
- ・明確な時間原点を持っている。

しかし、応用面から見れば、この加速器からの電子 線は強すぎる場合が多い。そのため我々のグループ では、これまで電子線形加速器で微弱ビームの発生 を試みてきた<sup>[1]</sup>。その結果、現在までに1マクロパ ルスあたり1fC以下の微弱ビームが得られている。

図1に、電子線形加速器の各電流レベルにおける 応用分野を示している。mAからµAという通常の電 流では、図のようにX線ラジオグラフィ、医療用照 射、材料照射、表面処理等に用いられている。より 低電流の領域では、生物の照射効果、放射線検出器 の応答評価など、大線量領域とは異なった応用分野 が期待される。非破壊検査の分野に限った場合でも、 電子線ラジオグラフィあるいは核反応分析といった 項目が新たな応用分野として加わることになる。こ のように、より微弱な電子線を発生させることがで きれば、多くの新たな応用が可能となることが考え られる。

また、これまで通常の強度の電子線を用いた放射 線測定では、X線バーストの影響を強く受けること が難点であった。これは超微弱ビームを用いること で解決すると考えられることから、本研究では電子 線形加速器から発生する微弱電子線を試料に入射し、 電子の準弾性散乱による核反応に伴って発生する中 性子を検出することによって試料の元素分析を行う 方法を検討した。



応用分野

2. 微弱電子線の発生

微弱電子線の発生には、大阪府立大学放射線研究 センターの電子線形加速器を用いた。この装置の概 略を図2に示す。加速器のビームを弱くするという 操作は簡単なものと見られがちであるが、十桁以上 の微弱化を行うにはいくつかの技術的な問題がある。 微弱化の方法としては図の上部に示すようにいくつ かの方法が考えられるが、例えば(4)の方法でビー ムを極端に絞ると、小角散乱成分が増加する等の問 題がある。本研究では主に(1)の方法を用いた<sup>[2]</sup>。





3. 電子の準弾性散乱

数MeV以上のエネルギーの電子線は、重元素に対して直接核反応を誘起することができる。これは図 3に示すように、重元素に高速電子が衝突し制動X 線(仮想光子)が発生し、光核反応したものと理解 されている。電子の準弾性散乱と呼ばれる、この反応で発生した中性子等を検出すれば核反応分析が可

能となる。これは①光核反応を利 用した光量子放射化分析法と同様 に、重元素の感度が高いことが期 待される。特にU、Th等の感度は 高い。②電子線は電磁気的に集束、 走査が容易であることから、γ線 法よりも局部的な感度が高く2次 元分析に適している。



4. 実験

図4に中性子検出体系を示す。電子線に照射され た試料から放出された中性子は、1m程度離れた場 所に設置されたBF3中性子検出器で検出される。こ の検出器は厚さ2cm程度のパラフィンで覆われてお り、入射した速中性子はここで減速され熱中性子と なり検出される。プリアンプから出力された信号は、 照射室の外に送られ最終的には多重波高分析器で計 測される。



図5に試料として鉛ブロックを置いた時のプリア ンプの出力波形を示す。照射した電子ビームは、 InCという通常のビームの1000分の1程度の微弱ビー ムであるが、中性子信号の手前に巨大なX線バース ト信号が発生していることが分かる。このX線は電 子線が試料に入射した際に発生する制動X線であり、 測定信号に比べて桁違いに大きな信号となることか ら、電子線を用いた放射線計測では避けることので きない問題とされてきた。X線バーストの発生は電 子線ビームの照射時に限られることから、このバー ストの大きさが測定システムの許容範囲に収まるな らば、図6のようなリニアゲート回路を用いてその 影響を軽減することができる。



図7にPbターゲットを10MeVの電子線で照射した際のBF3検出器の波高分布の例を示す。図は、横軸にパルス波高、縦軸に計数率を対数で表示している。これは1パルスあたり約30pCという超微弱ビームの照射であるが、中性子信号よりもX線バーストの方が優勢である。ただし熱中性子を計測する場合、熱化時間による遅れが利用できることから、電子ビーム発生から一定の時間信号を遮断することによってX線バーストの影響を軽減することができる。図7の下部の波高分布は、10 μ secのゲートをかけた例である。この程度のビーム強度に絞ることができれば、信号処理によって中性子計測は可能となることが分かる。ただし電子ビームがこれよりも大幅に強

い場合、X線バーストによる出力信号の歪が大きく なり、ゲートによる信号処理もあまり有効ではなく なる。



さらにビームを微弱化した場合のBF3出力の変化 を図8に示す。図7と同様に10MeVの電子ビームをPb ターゲットに照射したものである。図5(a)は150pC, (b)は40pC, (c)は15pC, (d)は5pCの照射である。ゲー トによる信号処理は加えていない。図のように、 ビーム強度が弱くなるに従いX線バースト信号の波 高は低くなり、同時に中性子信号の計数ピークは低 くなっている。また5pC程度になれば、X線バース ト応答は波高分布からは消え、ゲート操作なしでも 中性子の測定は可能であった。



パルス波高



この検出体系で、中性子の検出感度を測定した。 図9のようにAlターゲットに0.5mm厚の板状のPbを 貼り合わせ、0,1,2,3,4,6,8枚までそれぞれ10MeV の電子線を照射し、中性子を計測した。図10は横軸 にPbの枚数、縦軸に中性子の計数をとったグラフで ある。十分な線形性が得られており、電子ビームの 断面積、計数、Pbの密度と厚さから中性子1カウン トあたりPb約0.51mgが算出された。



図9 検出感度測定体系



### 5. 結言

電子線を試料に入射し、電子の準弾性散乱による 核反応分析を検討した結果、電子ビームを微弱化す れば、X線バースト信号の応答はリニアゲートの信 号処理によって圧縮できた。さらにビームを微弱化 すると、ゲート操作なしでも中性子の測定は可能で あった。この状態が確保できれば、高速中性子ある いは2次ガンマ線の測定も可能であると考えられる。

Pbを用いて中性子の検出感度を測定した結果、約 0.51mgで1個の中性子を放出することが分かった。 今回評価したPbと同じ重元素の中でも、光核分裂反 応が利用できるUあるいはThなどの核物質の検出感 度は、今回評価したPbよりもはるかに優れていると 考えられる。

[参考文献]

- [1] 谷口他、原子力学会2007年年会A09
- [2] Taniguchi et.al., Proc. of 20th Workshop on Radiation Detectors (Feb.2006, KEK, Japan)pp86-95